

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 9, 2010

**XVI Российский симпозиум по растровой электронной спектроскопии
и аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ-2009)
(ИПТМ РАН, Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова,
Научный совет РАН по электронной микроскопии, Черногоровка, 2009)**

- Особенности формирования перовскитовой фазы в тонких
поликристаллических пленках $Pb(Zr,Ti)O_3$
В. П. Пронин, С. В. Сенкевич, Е. Ю. Кантелов, И. П. Пронин 5
- Сравнение контраста протяженных дефектов в методах ХВИС и наведенного тока
Е. Б. Якимов 10
- АСМ-исследование пленок из УФ-отверждаемых порошковых композиций
на основе олигоэфирметакрилата
*Ю. В. Котова, М. Э. Вылегжанина, Т. Е. Суханова, А. И. Григорьев,
Л. М. Егорова, Н. А. Егорова, Н. Г. Кузина, Л. Н. Машляковский* 13
- Создание металлического рисунка заданной геометрии с помощью
протонного облучения через однослойную маску
Б. А. Гурович, А. Г. Домантовский, К. И. Маслаков 23
- Эволюция фазово-структурного состояния при отжиге пленок $Fe-ZrN$,
полученных методом магнетронного напыления
О. М. Жигалина, Д. Н. Хмеленин, Е. Н. Шефтель, Г. Ш. Усманова, М. Иноие 29
- Разработка метода электронно-оптического *in situ* мониторинга
периодических структур
М. Ю. Барabanенков, В. В. Казьмирук, Т. Н. Савицкая 35
- Периодические доменные структуры, сформированные при выращивании
монокристаллов $LiNbO_3$, легированных гадолинием
Л. С. Коханчик, М. Н. Палатников, О. Б. Щербина 42
- Электронно-микроскопические исследования повреждений поверхности
алюминиевого сплава АМгб, вызванных выделенными
на космических станциях микроорганизмами
*Т. А. Алехова, В. Я. Шкловер, Н. А. Загустина, Н. В. Швындина,
А. Д. Плотников, А. Л. Васильев* 49
- Исследование процесса прецизионного глубинного микропрофилирования
трехмерной кремниевой тензорамки на гетероструктуре КНИ
Л. В. Соколов, А. А. Жуков, Н. М. Парфенов, А. А. Данилин 56
- Исследование проводимости, индуцированной электронным пучком
в тонких пленках оксида кремния
С. С. Борисов, П. С. Вергелес, Е. Б. Якимов 62
- Сравнительный анализ катодного и магнетронного методов получения
пьезоэлектрических пленок $Pb(TiZr)O_3$
В. Г. Бешенков, А. Г. Знаменский, В. А. Марченко 67
- Исследование элементного и фазового состава тонких пленок PZT
по оже-спектрам при ионном профилировании
В. Г. Бешенков, А. Г. Знаменский, В. А. Марченко 71

Изучение облученных пленок сверхпроводников методами СЗМ	
<i>С. В. Антоненко, С. М. Толкачева, В. А. Фролова</i>	76
Ориентированная поверхностная автосегрегация в монокристаллах титаната свинца	
<i>Ю. Я. Томашпольский, Н. В. Садовская</i>	79
Эволюция структуры фуллеритовых пленок, конденсированных на различные подложки	
<i>Л. В. Баран</i>	84
К методике абсолютизации измерений интенсивности диффузного рассеяния на основе измерений теплового диффузного рассеяния	
<i>В. Т. Бублик, К. Д. Щербачев, М. И. Воронова, Е. В. Жевнеров</i>	89
Об одной возможности математического моделирования зависимости интенсивности катодолюминесценции от энергии электронов пучка при идентификации параметров полупроводниковых материалов с использованием аппроксимации степенными рядами	
<i>Т. И. Ковтунова, Н. Н. Михеев, А. Н. Поляков, М. А. Степович</i>	95
Диагностика методом ВИМС структуры нанометровых полупроводниковых слоев, легированных примесями	
<i>А. Н. Пустовит</i>	101
Особенности электронного обмена отрицательного иона водорода с атомными цепочками	
<i>Т. Н. Поливникова, К. К. Сатарин, А. А. Хайдаров, И. К. Гайнуллин</i>	105
Сканирующий ионный гелиевый микроскоп: распределение вторичных электронов и каналирование ионов	
<i>Ю. В. Петров, О. Ф. Вывенко, А. С. Бондаренко</i>	109
